# EU 規制に対応した環境負荷物質の分析技術

# Analytical Technology of Environmentally Hazardous Substances Responding to EU Regulations

岩瀬 和哉 IWASE Kazuya
JFE テクノリサーチ 分析・評価事業部 千葉事業所分析グループ長
川越三千男 KAWAGOE Michio
JFE テクノリサーチ 分析・評価事業部 知多事業所分析グループ長
平野 聖吉 HIRANO Masayoshi
JFE テクノリサーチ 環境技術事業部 環境調査部 DXN 分析グループ

#### 要旨

EU 規制を中心に、製品に含有する環境負荷物質が規制されており、それらを管理するための分析技術の重要 性が増している。本稿では、JFE テクノリサーチにおける環境負荷物質の分析技術を紹介する。エネルギー分散 型蛍光X線分析(EDXRF)を用い、環境負荷物質の濃度既知のプラスチックや金属試料を測定して検出限界値 を求め、EDXRF がスクリーニング分析の手法として有効であることを示した。化学的手法による重金属類の精密 分析は、ICP 発光分光分析法を中心とした機器分析法で実施している。高分解能質量分析計を用いる臭素系難燃 剤(PBBs(ポリ臭化ビフェニル類)、PBDEs(ポリ臭化ジフェニルエーテル類))の分析において、抽出方法およ び測定条件の最適化により、迅速で高感度な分析方法を確立した。

#### Abstract:

Environmentally hazardous substances in products are regulated mainly by EU directives and the analytical technique is key to the verification of them. In this paper, analysis techniques of environmentally hazardous substances in JFE Techno-Research are introduced. The plastics and metals with the reference values of these hazardous substances were analyzed by energy dispersive X-ray fluorescence analysis (EDXRF) to decide the detection limits of EDXRF. And EDXRF was proved to be effective as a screening technique. Precise analysis of heavy metals is carried out using instrumental analytical methods mainly of inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES). Rapid and high sensitive analysis of brominates flame retardants, such as polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenylethers (PBDEs), by high resolution gas chromatography-high resolution mass spectrometry has been established by optimizing an extraction method and measurement conditions.

## 1. はじめに

グローバル化が進んだ経済システムのもと、大量生産、 大量消費される工業製品はわれわれの生活を豊かにしてき た。その一方で、生産活動や消費活動で排出される CO<sub>2</sub> な どによる地球温暖化や、廃棄物などによる環境破壊など、 深刻な環境問題が顕在化している。それらの反省から、持 続可能な社会を目指した循環型経済社会作りのための取り 組みが、世界規模で模索されている。とりわけ工業製品の リサイクルは、天然資源の有効活用と廃棄物発生量抑制と いう観点から大変重要である。リサイクルを有効に進め、 かつ、廃棄物による地球環境の汚染を抑止するためには、 工業製品に含まれている環境負荷物質を管理することが重 要であり、このような環境配慮の観点からの法整備やさま ざまな取り組みが全世界で進められている。

特に、ヨーロッパ連合(EU)では、世界の環境政策を リードする法規制が進められている。電気・電子機器のリ サイクルを義務付けたWEEE指令(Waste Electric and Eletronic Equipment directive:廃電気・電子指令)、電気・ 電子機器へのPb,Cd,Hg,六価クロム、臭素系難燃剤 (PBBs(ポリ臭化ビフェニル類),PBDEs(ポリ臭化ジフェ ニルエーテル類))の含有を禁止したRoHS指令(Restriction of the use of the certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment directive:電気電子機器の特定有 害物質使用規制指令)、自動車のリサイクル促進や自動車 へのPb,Cd,Hg,六価クロムの使用を禁止したELV指令 (End-of-Life Vehicle directive:廃自動車指令),年間1トン 以上の化学物質の製造・輸入に対して登録・届出を義務付 ける Reach (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals: 新化学品規制,現在審議中)などがその代表で ある。これらは世界各国へも大きな影響をもたらし,米国 カリフォルニア州や中国,韓国でも RoHS 指令に類似した 規制する動きが進められている。

日本では、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法),資源有効利用促進法などの法整備がなされてきた。 また、2005年12月にはJ-Moss (JISC 0950「電気・電子 機器の特定の化学物質の含有表示方法(The marking for presence of thespecific chemical substances for electrical and electronic equipment)」)<sup>1)</sup>が制定され、資源有効利用促 進法に引用される形で RoHS 指令と同じ 6 物質について、 特定の電気・電子機器への含有の表示義務を負うことと なった。

このような動向の中,各業界団体やメーカーにおいても, JIG (ジョイント・インダストリー・ガイドライン,2005年 4月発行)<sup>2)</sup> に代表されるグリーン調達のガイドラインや社 内基準の制定,およびそれらをもとにしたサプライチェー ンの構築など,環境に配慮した取り組みが活発化しており, メーカー,サプライヤおよび消費者の環境負荷物質に対す る関心はさらに高まる傾向にある。

以上に述べた状況のもと、各企業は製品へ使用される材 料に含まれる環境負荷物質の種類および含有量に関する情 報を、正しく管理する必要性に迫られている。そのために は、さまざまな材料中の環境負荷物質を正確に分析するこ とが有効な手段であり、分析技術の重要性が高まっている。

## 環境負荷物質分析への JFE テクノリサーチの取り組み

環境負荷物質のさまざまな材料の分析ニーズに対し, JFE テクノリサーチでは千葉, 京浜, 知多, 倉敷, 福山の 5 拠点において, それぞれ分析に必要な装置・設備および 技術を有し, 的確に対応している。ELV 指令, RoHS 指令 の規定対象物質を含む分析対応可能な環境負荷物質の一例 および分析方法を Table 1 に示す。RoHS 指令に代表され る6物質はもちろんのこと, その他に JIG などで管理の対 象とされているほとんどの環境負荷物質の分析が可能であ る。

RoHS 指令の含有量のしきい値は、Pb, Hg, 六価クロム、 PBBs, PBDEs:1000  $\mu$ g/g, Cd:100  $\mu$ g/g であるが、各 企業は製品や材料の管理の必要性からさらに低い基準値を 設定している場合が多く、シングル  $\mu$ g/g ~ ng/g オーダー の検出下限を要求されるケースも多い。それらの要求に対 して、Table1に示したさまざまな分析方法を駆使して対応 している。

以下に、JFE テクノリサーチの環境負荷物質分析の取り 組みとして、スクリーニング分析として重要なエネルギー 分散型蛍光X線分析(EDXRF)による分析技術、重金属

Table 1	Analytical methods for environmentally hazardous
	substances at IFE Techno-Research

Material	Analytical method
Lead (Pb)/Lead compounds	EDXRF, ICP-OES, AAS, ICP-MS
Cadmium (Cd)/Cadmium com- pounds	EDXRF, ICP-OES, AAS, ICP-MS
Mercury (Hg)/Mercury compounds	EDXRF, ICP-OES, CVAAS, ICP-MS
Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )/ Hexavalent chromium compounds	EDXRF, ICP-OES, AAS, ICP-MS (as total), UV
Polybrominated biphenyls (PBBs)	HRGC-HRMS
Polybrominated diphenylethers (PBDEs)	HRGC-HRMS
Asbestos	XRD
Certain azocolourants and azodyes	GC-MS
Ozon depleting substances (CFCs, HCFCs, HBFCs, Carbon tetrachlo- ride, etc.)	GC-MS
Polychlorinated biphenyls (PCBs)	HRGC-HRMS
Polychlorinated naphthalenes	GC-MS
Radioactive substances	Scintillation counter method
Chlorinated paraffins	LC-MS or GC-MS
Tributyl tin (TBT) and triphenyle tin (TPT)	GC-MS
Tributyl tin oxide (TBTO)	GC-MS
Other metals (Sb, As, Be, Bi, Ni, Se, etc.) and these compaunds	EDXRF, ICP-OES, AAS, ICP-MS
Brominated flame retardants (other than PBBs or PBDEs)	HRGC-HRMS
Phthalates	GC-MS
Polyvinyl chloride (PVC)	HPLC

EDXRF: Energy dispersive X-ray fluorescence analysis

ICP-OES: Inductively coupled plasma optical emission spectrometry AA: Atomic absorption spectrometry

ICP-MS: Inductively coupled plasma mass spectrometry

CVAAS: Cold vapor atomic absorption spectrometry

UV: Ultraviolet and visible spectrophotometry

XRD: X-ray diffractiometry

HPLC: High performance liquid chromatography HRGC-HRMS: High resolution gas chromatography-High resolution mass spectrometry

GC-MS: Gas chromatograhy-mass spectrometry (Tandem mass spectrometry)

類の精密分析および臭素系難燃剤の分析技術について解説 する。

## 3. EDXRF によるスクリーニング分析

#### 3.1 概要

EDXRFは、迅速・非破壊・前処理不要・多元素同時測 定など優れた利点を持っていることから、ELV 指令や RoHS 指令で規制されている環境負荷物質のスクリーニン グ分析として利用されている。電気・電子機器などを EU に輸出した際には、税関の通関検査として、携帯型 EDXRF による一次スクリーニングが行われる場合がある。 携帯型 EDXRF は分析精度が十分でないため、ここで基準 値以上検出されると二次スクリーニングとしてより精度の 良い、以下に紹介する卓上型 EDXRF が用いられる。

各企業における RoHS 指令, ELV 指令対応やグリーン調 達関連の環境負荷物質分析においては、電気・電子機器製 品や自動車などひとつの製品を考えた場合、測定の対象と なる構成部品の種類が膨大な数になるため、そのすべてを 正確に測定することは、経済性・生産性・迅速性を考慮す ると得策ではない。そこで、まず EDXRF によるスクリー ニングを行い、環境負荷物質の含有が疑われるものについ て精密分析を実施するという手順で行われることが多い。 このような環境負荷物質の分析においては、材料の環境負 荷物質の含有量が、各規制または各企業の基準値以下であ ることを確認することが求められる。JFE テクノリサーチ 千葉事業所および京浜事業所では、これらの要望に応える ため、環境負荷物質の測定に対応した EDXRF 装置を導入 し、測定条件の最適化や、装置性能調査などの技術的な検 討を実施してきた。以下に、千葉事業所に導入した装置の 紹介および技術的な検討結果について述べる。

#### 3.2 装置の特徴

千葉事業所に導入した装置は、エスアイアイ・ナノテク ノロジー(株)製蛍光X線分析装置 SEA-2220A である。装 置の構成を Fig. 1 に示す。プラスチックのように主成分が 軽元素の場合、入射X線が散乱され大きなバックグラウン ドが形成されるために検出感度が悪くなる。本装置では散 乱X線によるバックグラウンドを低減させ、目的元素の ピークを際立たせる目的でX線管と試料の間に一次フィル タと呼ばれる金属薄膜フィルタを3種類(Cd用, Pb用, Cr用)備えている。

ー次フィルタの効果を示した例を Fig. 2 に示す。一次 フィルタを使用しない場合,プラスチックに見られる散乱 X線が強く現れ,目的元素のピーク/バックグラウンド (P/B)比が悪くなる。一次フィルタを使用すると目的元素 周辺のバックグラウンドが大幅に減少し,目的元素のピー クが際立ち, P/B比が改善していることが確認できる。ま た,EDXRFでは,ポリ塩化ビニル (PVC)のように Clを









多量に含有する場合や、試料の形状、厚さによってピーク 強度は大きく変わるが、本装置では CI や散乱 X 線を測定 し、これらを補正することで正確に測定することが可能と なっている。

#### 3.3 検出限界

スクリーニング分析において非含有と判定された場合, その材料は市場に流通することとなり,スクリーニング分 析の検出感度が判定基準を上回ると,基準値を超えた材料 が市場に出ることとなる恐れがある。したがって,検出限 界は確実に基準値をクリアすることが不可欠である。

検出限界は次式によって求められる。

検出限界 = 
$$3\frac{C}{I_{\text{net}}}\sqrt{\frac{I_{\text{BG}}}{T}}$$
 (1)

ここで、C:濃度、T:測定時間、Inet:ピーク強度、
I<sub>BG</sub>:バックグラウンド強度

Table 2 Measurement conditions of EDXF	onditions of EDXRF
--	--------------------

X-ray tube	Rh
Voltage	15 kV (Cr)
	50 kV (Cd, Pb, Hg, Br)
Collimator	$\phi$ 10 mm
Detector	Si(Li)SSD
Peak posision	Cd-Kα (23.11 keV)
	Pb-Lα (10.54 keV)
	Pb-L $\beta$ (12.63 keV)
	Hg-L $\alpha$ ( 9.98 keV)
	Br-Kα (11.91 keV)
	Cr-K $\alpha$ (5.41 keV)

JFE 技報 No. 13 (2006 年 8 月)

							(µg/g)
		Integral time (s)	Cd-Ka	Cr-Ka	Pb-La	Hg-La	Br-Ka
Dlastia	Non PVC	200	3	4	5	4	2
Plastic	PVC	200	5	9	7	6	4
	Al base	300	6	22	18		
Metal	Fe base	600	_	43	56	_	_
	Cu base	600	23	55	64	_	_
	Sn base	600	_		51*	—	_

Table 3 Lower limit of detection of environmentally hazardous substance in samples

Sample size:  $t2 \text{ mm} \times \phi 10 \text{mm}$  (Plastic),  $\phi 10 \text{ mm}$  (Metal)

-: Not calibrated

\* Without filter





さまざまな濃度既知の試料を測定し、(1)式を用いて本装 置の検出限界を求めた。本測定で採用した条件を **Table 2** に、求めた検出限界を **Table 3** に、X 線スペクトルの一例 を **Fig. 3** に示す。一次フィルタを使用して測定するとプラ スチックの場合、厚さ2mmの試料での検出限界は 10 µg/g 以下となり、十分な感度が得られている。また、 各種金属でも測定時間を十分取ることにより、しきい値の 1/10から1/20以下の感度が得られた。しかし、Fig.3 試 料(D)にみられるようにマトリックスがSnなどの重金属 では、一次フィルタを用いない方がPbの検出感度は良く なる場合がある。このように検出限界は、試料の形状や厚 さ並びにX線の照射面積によって大きく左右されるととも



Fig. 4 Comparison of analytical values of Cr, Pb, and Cd in resin samples by EDXRF and ICP-OES

に、マトリックスによっては、一次フィルタを使用しない 方が良い場合がある。プラスチックなどの高分子材料はX 線の侵入深さが数ミリメートルから十数ミリメートルに及 ぶため、厚さによって検出感度が異なる。一方、金属の場 合はX線の侵入深さは数マイクロメートルから十数マイク ロメートル程度であるため、X線の照射面積が十分(本装 置の場合、φ10 mm)得られるバルク試料であれば、検出 限界は測定時間によってほぼ決まる。つまり検出限界を 1/2にしようとするならば測定時間を4倍にする必要があ る。実際の依頼試料では材質や形状がさまざまであるた め、十分な感度が得られるように考慮して測定時間を設定 している。

#### 3.4 測定例

EDXRFによる定量は、含有量既知の標準物質で装置校 正をする検量線法と、理論計算で求めるファンダメンタル パラメーター法(FP法)がある。Fig.4に、検量線法によ る各種プラスチック中のCd、Pb、および、Crを本装置で 定量した結果と、誘導結合プラズマ発光分光分析法(ICP-OES)による分析値との比較を示す。本装置による定量値 はICP分析値と良く一致した結果となった。

このように検量線法による EDXRF の測定では、本測定 結果に示すように、条件が合えば正確な定量値を得ること ができる。しかし、3.3 節に述べたように材質や形状などの 試料特性により、正しい定量値が得られない場合もある。 また、FP 法は標準物質がなくても定量値を出せるが、より 正確に定量するためには、標準物質の整備および正確な補 正を行うためのバックデータやソフトウェアの充実が不可 欠である。

### 4. 重金属分析の精密分析

EDXRFによるスクリーニング分析で検出された場合な ど、材料に含まれる環境負荷物質の濃度を正確に求めるた めには、化学的手法による精密分析をすることが有効であ る。Table 1 に示すように、RoHS 指令、ELV 指令の規制対 象となる Pb, Cd, Hg, Cr (トータルとして)およびその 他の Sb, As, Be, Bi, Ni, Se などの重金属類の分析は, ICP-OES, 原子吸光法 (AA), ICP 質量分析法 (ICP-MS) などの各種機器分析法で対応している。また, 六価クロム の分析は各種抽出方法と吸光光度法との組み合わせで対応 している。

先に解説した EDXRF とは異なり,これら分析手法は,酸分解などにより試料を化学的に分解後,溶液試料を分析装置に導入するケースがほとんどである。

分析対象物質としては, RoHS 規制などに対応する分析 が急速に広まった当初は, Cd や Pb が混入するリスクの高 いプラスチックが中心あったが、最近は電気・電子機器や 自動車を構成する, プラスチックを含む塗料やゴムなどの 有機材料, 鉄鋼やはんだ, 各種非鉄合金, めっきなどの金 属材料, ガラスやセラミックスなどありとあらゆる材料に 及んでいる。これらの材料に含まれる Pb や Cd などの金属 元素を精密に分析するためには, まず溶液化する必要があ り, 各種材料に対応できる分解技術が要求される。

JFE テクノリサーチでは,鉄鋼・非鉄金属材料・環境試 料分析を中心に,あらゆる材料の成分分析を長年実施して おり,そこで培った試料分解技術を応用してこれら要求に 対応している。

電子部品の配線に用いられる,はんだおよびリード線の めっき(スズめっき,はんだめっきなど)へ,不純物とし て Pb が混入することが懸念されている。はんだやめっき 浴のバルクが入手可能であればこれらの分析は比較的容易 であるが,実装部品の場合は分析対象が非常に微少領域に なるため,通常のバルク分析の技術だけでは対応できない。 微少領域のスポット分析に関しては、レーザーアブレーショ ン- ICP 質量分析法<sup>3)</sup> で微少領域を直接分析することや, 極微少量のはんだ片やめっき層を化学的に溶解し,電気加 熱原子吸光法または ICP 質量分析法などの超高感度分析手 法を用いて正確に微量域まで定量することも可能である。

#### 5. 有機臭素系難燃剤の分析技術について

### 5.1 RoHS 指令の有機臭素化合物について

難燃剤として幅広く使用されていた,PBBs,PBDEs (Fig. 5)は、燃焼・光分解反応により強毒性である臭素化 ダイオキシンが生成することが明らかになってきている<sup>4)</sup>。 そのため、RoHS 指令により製品への含有が制限され、材 料に含まれる PBBs,PBDEs の管理が必要となった。これ



PBBs PBDEs Fig. 5 Structures of PBBs and PBDEs

JFE 技報 No. 13 (2006 年 8 月)

により迅速かつ高精度な分析が求められてきている。

PBBs, PBDEs の分析には,非常に多種類の有機化合物 を高感度かつ高分解能に分析することが可能である高分解 能質量分析計(HRGC-HRMS)を用いて実施している。多 種類の異性体を持つ PBBs,PBDEs のうち,八臭素化ジフェ ニルエーテル(OcBDE)~十臭素化ジフェニルエーテル (DeBDE)の高臭素化体は,熱・光分解反応が著しい上, 高質量数であるため HRGC-HRMSの感度も得られにくいな ど,この分析には非常に困難な側面もあり,高度な技術を 必要とする。

JFE テクノリサーチでは、これまで長年培ってきたダイ オキシン類<sup>5)</sup> や PVC, 農薬,環境ホルモンなどの環境分析 における高度な前処理技術およびクロマトグラフィーを中 心とした測定技術を活用し,有機臭素系難燃剤の抽出方法 や分析条件の最適化を行ってきた。以下に,開発した分析 方法と測定例を解説する。

#### 5.2 分析方法

#### 5.2.1 分析フロー

サンプルの種類・形態は、ダンボールなどの紙類、ペ レット状・粉状・ペースト状・成型体の樹脂と、さまざまで ある。代表的な分析方法のフローを **Fig. 6** に示す。また、 これら一連の作業は光分解を防ぐために、遮光下で実施し ている。

#### 5.2.2 抽出・クリーンアップ方法

通常、塩素化ダイオキシン類の固形物からの抽出方法は、 トルエンによるソックスレー抽出が一般的だが、有機臭素 化合物は熱・光分解反応が塩素系よりも著しく、長時期間 の抽出工程を可能な限り避けることが重要である。そこで、 JFE テクノリサーチでは、PBBs、PBDEsの分析にはトル エン - 超音波抽出を主な抽出方法として採用している。こ



Fig. 6 Analytical procedure for PBBs, PBDEs



△ Dissolving analyte
○ Dissolving resin

The resin solidifies again

Fig.7 Re-precipitation method for separating analyte from the resin

れにより1週間近く要する抽出工程を,1~2日に短縮す ることができ,熱・光分解を最小限に抑えることが可能と なった。

また,クリーンナップ工程としては抽出工程と同様に, 塩素化ダイオキシン類ではさまざまなカラムクロマト処理 をしているため長時間を要するが,これらを使用しない再 沈法を用いている。

再沈法は、有機溶剤中に溶けている樹脂分と目的成分を 溶解度の違いを利用し、分離する方法である(Fig. 7)。ま た、この方法による ABS 樹脂からの DeBDE 回収率は 99%以上であることを検証している。この操作により、測 定におけるマトリックスである、樹脂分を容易に分離し、 高感度かつ迅速な測定が可能となった。

5.2.3 測定方法

JFE テクノリサーチでは HRGC-HRMS を 4 台有している が、このうち1台を有機臭素化合物専用機とし、常時測定 可能な状態としている。

以前は、PBBs、PBDEs 分析は多種類のキャピラリーカ ラムを使用し、長時間かけて測定することが一般的であっ たが、JFE テクノリサーチでは、単体ですべての PBBs、 PBDEs が測定可能な ENV-5MS カラム(関東化学(株)製) などをいち早く取り入れ、測定分析条件を検討することで、 正確かつ迅速な分析方法を確立した。**Table 4** にその測定 条件の一例を上げる。

## 5.3 応用技術

RoHS 指令関連の PBBs, PBDEs 分析が始まった当初は, 対象は素材の分かっている樹脂などが多かったが,現在で は多種多様な試料が分析対象となった。このような状況下 で,5.2.1 項で基本的な分析方法を示したが,すべての試料 に統一した分析方法は通用せず,試料の溶解性などの特質 に合った抽出・クリーンアップ方法が要求される。

製品中の抽出方法別の分析値比較例を **Table 5** に示す。 試料溶解にはテトラヒドロフラン (THF) が使用される ことが多い。しかし, THF - ソックスレーにより抽出した 場合, Table 5 に示したようにトルエン - ソックスレー抽出 では 95 000 µg/g 程度あった DeBDE が約 1/100 以下とな

deca-BDE	
MS (Mass spectrometer)	Auto spec ultima (Waters Corporation)
GC (Gas chromatograph)	HP 6890 (Agilent Technologies Inc.)
Column	ENV-5MS capillary column $15 \text{ m} \times 0.25 \text{ mm id}$
Column temperature	120°C (1 min hold)–180°C (20°C/min) –300°C (5°C/min, 2 min hold)
Resolution	10 000 or more
Electron acceleration voltage	40 eV
Ionization current	600 µA
Ion acceleration voltage	8 kV
Injection temperature	280 °C
Carrier gas	He (Constant flow: 1.0 ml/min)

Table 4	Analytical condition of GC-MS for octa-, nona-, and
	deca-BDE

Table 5 Comparison of extraction procedures of PBDEs from resin

Solvent		Toluene		THF		
Extraction method		Soxhlet	Supersonic wave extraction	Soxhlet	Supersonic wave extraction	
Sample volume (g)		0.068	0.071	0.072	0.076	
Sample volume extraction	e after (g)	0.023	0.060	0.055	0.065	
Dissolution rate (%)		66	16	24	14	
OcBDEs	$(\mu g/g)$	40	30	9 100	35	
NoBDEs	$(\mu g/g)$	1 200	1 000	2 800	1 000	
DeBDE	$(\mu g/g)$	95 000	87 000	764	75 000	
Total PBDEs	$(\mu g/g)$	96 000	88 000	15 000	76 000	
Total Br in the sample after extraction by combustion ion chromatograph (%)		N.D.	N.D.	0.5	2.1	

N.D.: Not detection (Less than 0.01%)

り、その代わりに NoBDEs、OcBDEs が熱・光分解による 脱臭素化で増加している。また, THF - 超音波抽出におい ては、全体的に抽出効率が悪くなる傾向にある。これは Table 5 の抽出残サンプルを、燃焼イオンクロマト法で全臭 素イオン分析した結果から分かる。THF-ソックスレーで は脱臭素化が著しく、THF - 超音波では抽出効率に問題が 生じる。

そこで、IFE テクノリサーチでは、トルエン - 超音波抽 出法を基本に用いている。塩素化ダイオキシン類分析にお いての固体からの抽出方法は、トルエン-ソックスレー抽 出が一般的とされている。そこでトルエン-ソックスレー 抽出と比較した場合、トルエン - 超音波では 90%以上回収

されている (Table 5)。また、トルエン - ソックスレーでは 目的成分以外に樹脂などマトリックスも溶解しており、そ の後のクリーンアップ・測定過程に大きな影響を及ぼすこ ととなる。その点、トルエン - 超音波抽出は、余計な樹脂 分を溶かすことなく目的成分を効率よく抽出することが可 能であり, 短時間での抽出のため, 熱・光分解による脱臭 素化のリスクも軽減できる。

一方, 試料によっては, THF を用いないと溶解が難しい ものもあり、事前に溶解試験などを行ってから本分析に入 るケースが多くなっている。さらに、分析結果から抽出・ クリーンアップ中に PBBs, PBDEs が分解されているか否 かを, 蓄積データなどから判断することも重要となる。

現在、このような技術を用い、短期間で数グラムの試料 から pg/g レベルの分析が可能である。今後は、関連する 技術の向上を図り、さらに生活環境中などの有機臭素化合 物についても、分析技術を確立していく予定である。

## 6. おわりに

JFE テクノリサーチにおける、EU 規制を代表とする各 種規制対応の環境負荷物質の分析技術について解説した。 RoHS 規制や J-Moss の本格運用を迎え、今後も環境負荷物 質の分析に対するニーズは高まるものと考えられる。法規 制や顧客のニーズを的確にとらえ,必要な分析技術の整備 を進め、リサイクルを基盤とした循環型社会の形成に向け た取り組みの助力となるよう努力していきたいと考えてい る。

#### 参考文献

- 1) 日本規格協会. JIS C 0950. 2005.
- 2) EIA(Electronic Industries Alliance). Joint Industry Guide(JIG), Material Composition Declaration for Electronic Products. 2005.
- 3) 坂下明子, 望月正. JFE 技報. no. 13, 2006.
- 4) 太田壮一, 奥村尚志, 西村肇, 青竹治, 中尾章幸, 宮田秀明. 第11 回環境化学討論会要旨集. 2002, p. 584-585.
- 5) 林沙織, 大塚健次, 古野直樹. 第14回環境化学討論会要旨集. 2005, p. 360–361.







平野 聖吉